

## Test de circuitos integrados VLSI y sistemas robustos.

Petrashin, Pablo Antonio dir. (2016) *Test de circuitos integrados VLSI y sistemas robustos*. [Proyecto de Investigación]

El texto completo no está disponible en este repositorio.

### Resumen

El objetivo general será la búsqueda de arquitecturas circuitales que permitan el fácil testeo del chip, la robusticidad ante daños por radiación y su implementación en tecnologías CMOS.

**Tipología documental:** Proyecto de Investigación

**Palabras clave:** Microelectrónica. Fallas. Sistemas Robustos.

**Descriptores:** [T Tecnología > TK ingeniería eléctrica. Ingeniería electrónica nuclear](#)

**Unidad Académica:** [Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ingeniería](#)